XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

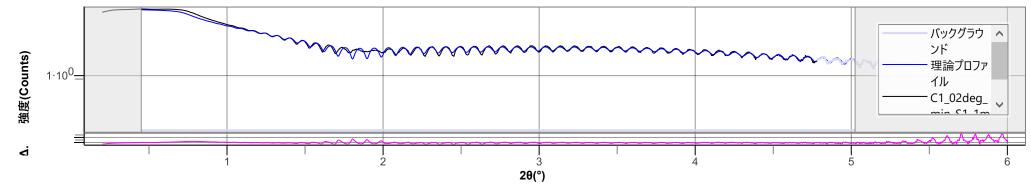
ステップ = 0.004 オフセット=0.000e+000 フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>		
✓	L5	Fe2O3	0.694	Const		4.94999	Const	0.100	Con
			±0.017	精密化	±0.07	\rightarrow	最大 精密化	±0.03最小←	精密化
\checkmark	L4	Fe2O3	1.588	Const		2.66945	Const	0.100	Con
			±0.016	精密化	±0.02	最小←	精密化	±0.04最小←	精密化
✓	L3	Fe Fe	3.660	Const		7.87400	Const	0.067	Con
•			±0.6	精密化	±0.06	\rightarrow	最大 精密化	±0.02最小←	精密化
✓	L2	* * o Fe	87.89	4 Const		7.20848	Const	0.100	Con
			±0.02	精密化	±0.05	\rightarrow	最大 精密化	±0.04最小←	精密化
✓	L1	Fe Fe	0.000	Const		3.93700	Const	0.100	Con
~			±0.2 最小←	精密化	±0.16	最小←	精密化	±0.04最小←	精密化
	基板	🖸 Si		∞		2.32924	Const	0.500	Con